

Model : RT-70V シリーズ

接触式（4探針法）シート抵抗/抵抗率測定システム



容易にご使用頂けるマニュアルタイプ測定システム
サンプルに合わせて選択頂ける豊富な測定ステージラインナップ

機能・特長

- 測定テスター：RT-70Vと、全4種の測定ステージの組み合わせ測定システム
（*サンプルの形状・サイズなどに合わせて、裏面記載の測定ステージをお選び下さい）
- JOGダイヤルによる簡単な操作・厚さ・温度・PNタイプの入力
- セルフテスト機能、自動測定レンジ切替え、4種類の測定モード
- 厚さ・温度補正機能付き（シリコン用）
- JIS規格/ASTM規格に準拠

JIS : JIS H 0602-1995

JIS K 7194-1994

ASTM : ASTM F 84-99 (SEMI MF84)

ASTM F 374-00a

ASTM F 390-11

ASTM F 1529-97

測定レンジ

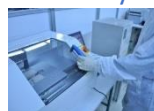
測定項目	測定レンジ
V/I Ratio	1.0m ~ 3.0M ohm
シート抵抗	5.0m ~ 10.0M ohm/sq
抵抗率（スライス：0.01~9999.99 μ m）	1.0 μ ~ 300.0k ohm.cm

測定対象

- 半導体・太陽電池材料関連
（シリコン、ポリシリコン、SiCなど）
- 新素材・機能性材料関連
（カーボンナノチューブ、DLC、グラフェン、銀ナノワイヤーなど）
- 導電性薄膜関連（メタル、ITOなど）
- 拡散サンプル シリコン系エピタキシャル、イオン注入サンプル
- その他
（*4探針で通電可能であれば、原則測定可能です。）

対象サイズ

*各測定ステージにより異なります。
裏面をご参照下さい。



測定ステージ：ラインナップ

*ご要望により、カスタマイズ、オーダーメイドも承ります。



RT-70V / RG-7C
(テスター+Z軸モーター上下ステージ)
 対象サイズ：～300mm(12インチ)
 厚さ：10mm以下

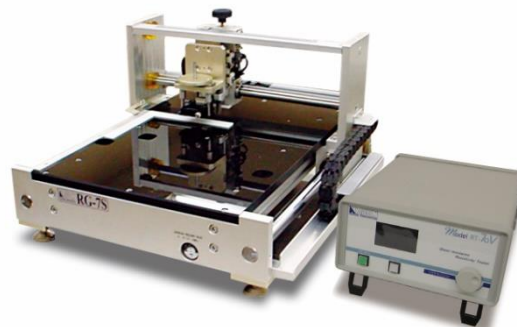


RT-70V / RG-5
(テスター+Z軸ハンディレバー上下ステージ)
 対象サイズ：～200mm (8インチ)
 厚さ：10mm以下



RT-70V / TS-7D
(テスター+ハンディプローブ)
 対象サイズ・厚さによらず測定可能

*ステージプレートはオプションです。



RT-70V / RG-7S
(テスター+X-Y-Z軸可動ステージ)
 対象サイズ：～500 x 500mm
 厚さ：10mm以下

測定精度・測定再現性

測定精度	測定再現性
標準抵抗ウエハの保証値に対する測定結果のかたより	標準抵抗ウエハ内の同一点10回繰返し測定の変動率
%BIAS < ±1%	CV ≤ 0.7%
$\%BIAS = \frac{\bar{X} - NIST保証値}{NIST保証値} \times 100[\%]$ $\bar{X} \text{ -----10回繰返し測定 of 平均值 (23℃)}$	$CV = \frac{\sigma}{\bar{X}} \times 100[\%]$ $\frac{\sigma}{\bar{X}} \text{ -----10回繰返し測定 of 標準偏差}$ $\bar{X} \text{ -----10回繰返し測定 of 平均值 (23℃)}$

*テスター：RT-70V単体の測定精度・再現性です。
 システムとしての測定精度・再現性は、測定ステージ、4探針プローブの精度・影響によります。

☆弊社ウェブサイトにも本製品のムービーを掲載しております。[リンク](#)よりご覧ください。

- 詳細のお問い合わせは下記までご連絡ください。
- 実機でのサンプル測定が可能です。お気軽にご相談下さい。
- 記載の仕様および外観は、予告なく変更する場合がございます。